

走査型プローブ顕微鏡の制御ステーション「AFM5000II」

—進化したパラメーター自動調整機能と新 GUI で手軽にナノ領域観察を実現—

走査型プローブ顕微鏡（SPM : Scanning Probe Microscope）は試料と探針間の原子間力、固さ、粘弾性、摩擦、電気、磁気などの様々な物理量を検出し、ナノレベルでサンプル表面の形状観察や物性マッピングを行うことができる装置で、利用分野が大きく広がっています。日立ハイテクサイエンスの SPM 制御ステーション「AFM5000II」は進化した測定パラメーター自動調整機能 RealTune（リアルチューン）II を標準搭載するとともに、分かりやすさを追求した GUI に一新しました。これにより SPM 初心者、また初めて測定する試料でも、再現性の高いデータが取得できます。

【主な特長】

1) 進化したパラメーター自動調整機能 RealTuneII

測定時に調整が必要なパラメーター全てを自動調整するので、熟練したオペレーターがいなくても再現性の高いデータが取得できます。測定時の力、走査周波数、制御ゲインに加え、新たにカンチレバーの動作周波数と振幅も総合的に自動調整を行い、接続機種、カンチレバーの種類、表面形状、探針・試料間の状態に合わせて、最適な測定条件を提供します。

2) 新 GUI

アイコン表示で見やすさ、使いやすさ、分かりやすさを追求しました。表示する情報を厳選することにより、初心者から上級者まで幅広いユーザーが迷わずに操作することができます。また、パラメーター自動調整機能 RealTuneII との組み合わせにより、試料とカンチレバーのセット後はワンクリックで測定することができます。

【主な仕様】

| | |
|--------------|--|
| 標準搭載機能 | RealTuneII（パラメーター自動調整機能）、探針評価機能、ナビゲーション（操作手順説明）、ワンクリック自動測定 |
| 接続機種（測定ユニット） | AFM5100N、AFM5200S、AFM5300E |
| 本体外形寸法、質量 | 220mm(W)×500mm(D)×385mm(H)、約 15kg |

【価格（税別）】 AFM5100N/5200S ユニット用 500 万円から
AFM5300E ユニット用 800 万円から

【販売目標台数】 250 台/年間

【製品 WEB サイト】 <http://www.hitachi-hitec-science.com/products/spm/AFM5000II.html>

■お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクサイエンス
分析営業部
担当：水口、岡村 TEL：03-6280-0077

■報道機関お問い合わせ先

株式会社日立ハイテクノロジーズ
CSR 本部 CSR・コーポレートコミュニケーション部
担当：武内、松本 TEL：03-3504-7760